

【11】證書號數：M565791

【45】公告日：中華民國 107 (2018) 年 08 月 21 日

【51】Int. Cl.： G01B7/06 (2006.01)

新型

全 4 頁

【54】名稱：樓板厚度量測結構

【21】申請案號：107207435

【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 06 月 04 日

【72】新型創作人：蔡銘儒 (TW)；王天志 (TW)；詹家旺 (TW)；邱英倫 (TW)

【71】申請人：內政部建築研究所

新北市新店區北新路三段 200 號 13 樓

【74】代理人：陳豐裕

【57】申請專利範圍

1. 一種樓板厚度量測結構，其主要係包括有支撐架、上部測距儀及下部測距儀；其中：該支撐架，其上端向一側延伸凸設有上支撐桿，且於該支撐架下端對應該上支撐桿則延伸凸設有下支撐桿；該上部測距儀，其設置於該支撐架之該上支撐桿外端，該上部測距儀朝下進行距離偵測，且令該上部測距儀與一控制裝置進行連線；該下部測距儀，其設置於該支撐架之該下支撐桿外端與該上部測距儀對應位置處，該下部測距儀與該上部測距儀相對朝上進行距離偵測，並令該下部測距儀與該控制裝置進行連線。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述樓板厚度量測結構，其中，該上部測距儀與該下部測距儀皆係為雷射測距儀。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述樓板厚度量測結構，其中，該上部測距儀係經由上部萬向接頭與該支撐架之該上支撐桿結合。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述樓板厚度量測結構，其中，該下部測距儀係經由下部萬向接頭與該支撐架之該下支撐桿結合。

圖式簡單說明

第一圖：本創作之立體結構示意圖

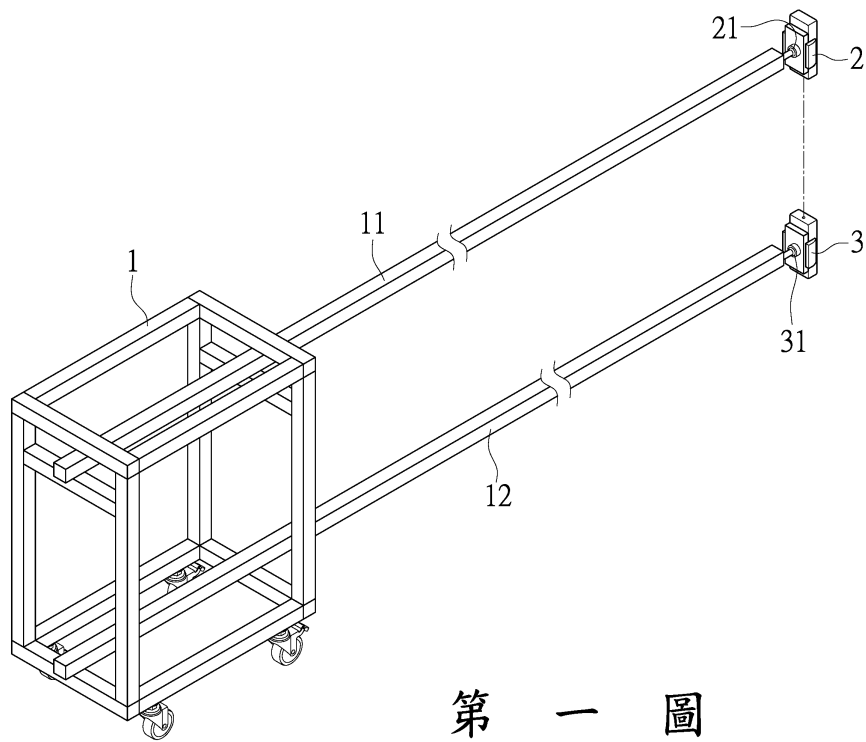
第二圖：本創作之基準板量測狀態示意圖

第三圖：本創作之待測樓板量測狀態示意圖

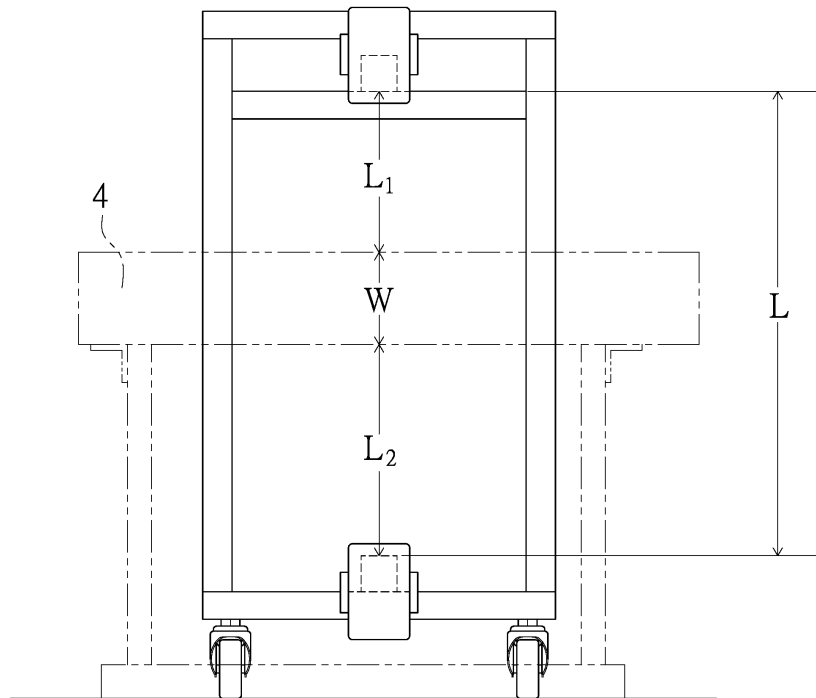
第四圖：本創作之待測樓板量測狀態側視示意圖

第五圖：本創作之待測樓板量測狀態局部放大立體示意圖

(2)

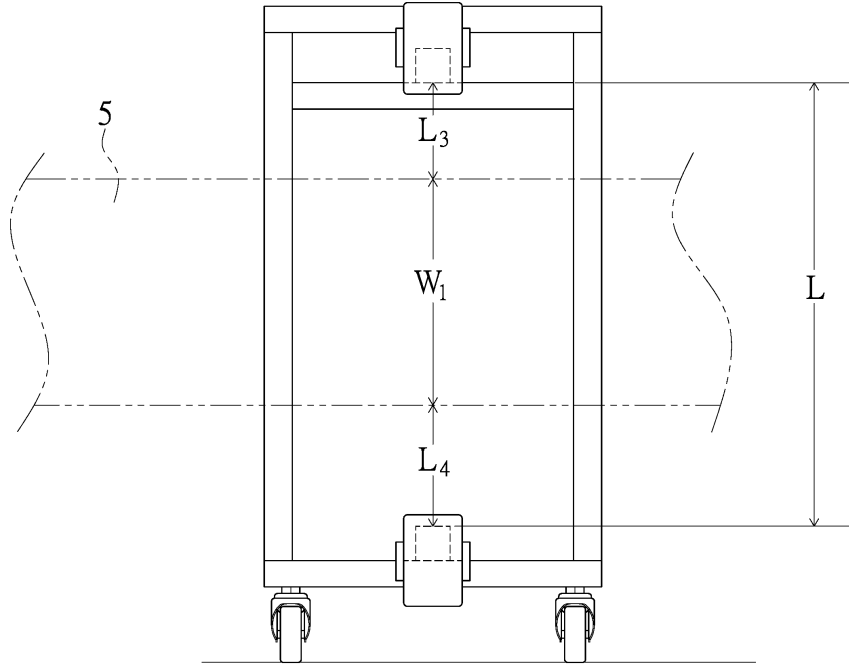


第一圖

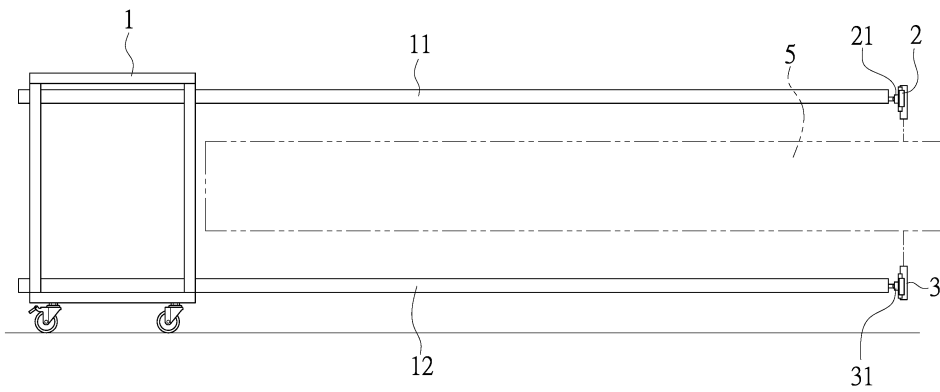


第二圖

(3)

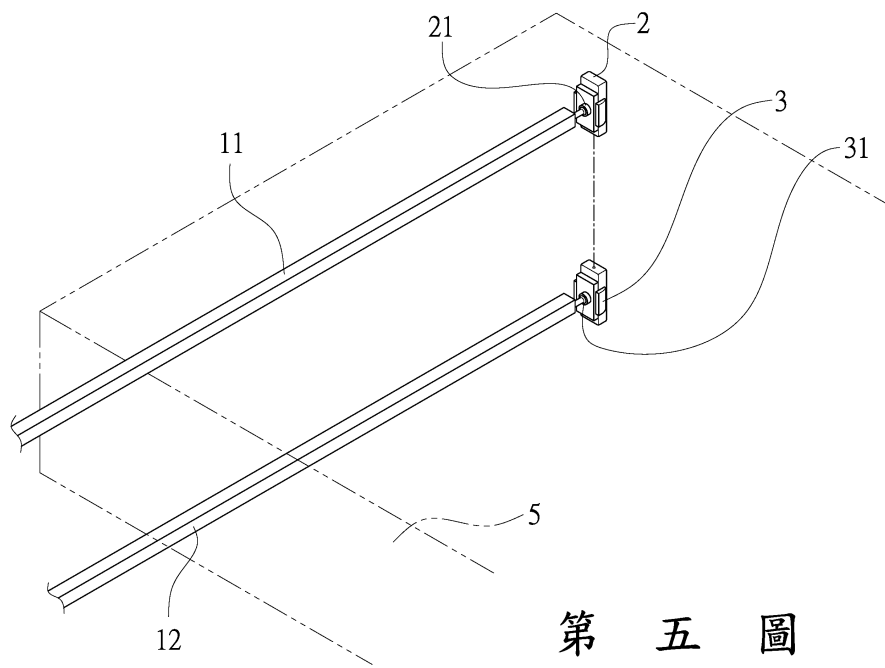


第三圖



第四圖

(4)



第五圖